

# 用于太阳电池吸收层的 Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> 薄膜 的制备及其光电特性 \*

邵乐喜<sup>1,†</sup> 付玉军<sup>2</sup> 张军<sup>1,2</sup> 贺德衍<sup>2</sup>

(1 湛江师范学院物理科学与技术学院, 湛江 524048)

(2 兰州大学物理科学与技术学院, 兰州 730000)

**摘要:** 采用真空蒸镀技术在钠钙玻璃衬底上蒸镀 Cu/Sn/ZnS 前驱体, 在氮气保护下, 硫化制备了 Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) 薄膜。运用 X 射线衍射仪 (XRD)、Hall 效应测试仪、紫外-可见光 (UV-VIS) 分光光度计对样品进行了表征分析, 研究了前驱体中预计原子比对 CZTS 薄膜的晶体结构及光电特性的依赖关系。通过对蒸发源 Cu 的质量的控制与微调, 获得了具有单一相类黝锡矿结构的 CZTS 薄膜, 其对可见光的光吸收系数大于 10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup>、光学禁带宽度约为 1.51 eV, 薄膜的电阻率、载流子迁移率和载流子浓度分别为 1.46 Ω·cm, 4.2 cm<sup>2</sup>/(V·s) 和 2.37 × 10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>, 适合作为薄膜太阳电池的吸收层。

**关键词:** Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>; 真空蒸镀; 硫化; 太阳电池

PACC: 6855; 8115; 7865P

中图分类号: TN304.2<sup>+</sup>1

文献标识码: A

文章编号: 0253-4177(2007)S0-0337-04

## 1 引言

四元化合物半导体 Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) 由于具有与太阳光谱非常匹配的直接带隙 (1.4~1.5 eV) 和对可见光的高吸收系数 (10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup>) 而成为最具潜力的新型薄膜太阳电池吸收层材料。CZTS 中 Zn 和 Sn 元素在地壳中的丰度分别为 75 和 2.2 ppm, 资源丰富且因不含毒性成分而对环境友好<sup>[1~3]</sup>。1967 年, Nitsche 和 Sargent<sup>[4]</sup> 利用碘气相输运法成功制备出单晶 CZTS, 得到的 CZTS 晶体具有类似于 Cu<sub>2</sub>FeSnS<sub>3</sub> 的黝锡矿结构<sup>[5]</sup>; CZTS 的类黝锡矿结构可看作是由 Zn 和 Sn 原子分别取代具有黄铜矿结构的 CuInS<sub>2</sub> 中一半的 In 原子而构成。1988 年, Ito 和 Nakazawa<sup>[1]</sup> 用原子束溅射技术首次成功制备了 CZTS 薄膜, 并报道了 CZTS/CTO 异质结二极管的开路电压为 165 mV。1997 年, Friedlmeier<sup>[6]</sup> 报道由真空蒸镀金属单质和二元硫化物的方法制备的 CZTS 薄膜与 CdS/ZnO 构成的 ZnO/CdS/CZTS 异质结, 具有 570 mV 的开路电压和 2.3% 的转换效率。2003 年, Katagiri 的研究小组<sup>[7]</sup> 在钠钙玻璃衬底上采用 ZnO:Al/CdS/CZTS/Mo 的电池结构, 得到 5.45% 的转换效率。CZTS 薄膜为多元化合物, 其光电性能对原子配比及晶格

匹配不当而产生的结构缺陷十分敏感, 致使以 CZTS 为吸收层的薄膜太阳电池的转换效率远远低于 CuInSe<sub>2</sub> 19.2% 的转换效率。显然, 发展和完善高质量、高均匀度 CZTS 薄膜的制备技术, 在深入研究其结构特性与光电学性能的基础上, 掌握影响光电性能的关键因素及作用机制, 进而探索提升 CZTS 薄膜太阳电池转换效率的有效途径, 成为当前该领域研究的重大课题。

本文采用工艺简单、成本低廉的真空蒸镀技术, 结合硫化方法制备了用于太阳电池吸收层的高质量 CZTS 薄膜, 我们选用 ZnS 作为前驱体蒸镀材料, 以增加 CZTS 薄膜与衬底间的粘附力<sup>[8]</sup>。在对前驱体组成成分的化学配比进行控制和微调的基础上, 研究前驱体的化学配比对薄膜的结构及光电学特性的影响。

## 2 实验

CZTS 薄膜的制备过程分两步进行: (1) 采用真空蒸镀技术在钠钙玻璃衬底上沉积 Cu/Sn/ZnS 前驱体; (2) 在氮气保护下, 硫化前驱体制备 CZTS 薄膜。实验采用 DM-300B 型真空镀膜机, 通过控制蒸发源的质量 (Mettler-Toledo AE240 型分析天平称得), 调节前驱体组成成分的化学配比。首先蒸镀

\* 国家自然科学基金资助项目(批准号: 10574106)

† 通信作者。Email: shaolx@mail@163.com

2007-01-05 收到, 2007-03-06 定稿

©2007 中国电子学会

ZnS,再依次蒸镀金属 Sn 和 Cu,蒸发源完全蒸发。蒸发装置的三个蒸发源在同一个水平面上,蒸发源与衬底的距离为 30cm,为了增加薄膜的均匀性衬底可以在水平方向转动。具体实验条件如下:ZnS 晶粒、Sn 粒和 Cu 片的纯度为 99.99%;衬底为钠钙玻璃,经有机溶剂浸泡、超声波清洗,烘干后送入真空室,衬底不加热;ZnS 的蒸发舟为金属 Ta 制造,Sn 和 Cu 的蒸发舟为金属 Mo 制造;系统真空中度高于  $2 \times 10^{-3}$  Pa;蒸发温度由电流源和热电偶共同控制,ZnS 的蒸发电流为 160A,温度为 1200°C,Sn 的蒸发电流为 90A,温度为 800°C,Cu 的蒸发电流为 110A,温度为 1100°C。

硫化装置如图 1 所示,前驱体样片位于硫化炉的中心处,温度为 550°C,单质硫放于钼舟内,改变钼舟在石英管中的位置,使其处于温度为 180°C 处。将前驱体样片在常压下、流量为 10sccm 的氮气和硫蒸气的混合气流中硫化退火 3h。利用 X 射线衍射仪(Philips Rigaku D/Max-IIIC)对样品进行 XRD 测试( $\text{CuK}\alpha, \lambda = 0.154056\text{nm}$ ),光吸收特性由紫外-可见光(UV-VIS)分光光度计(UV2300)测量,薄膜的电学性质由 Hall 效应测试仪(EGK HEM-2000)测量。

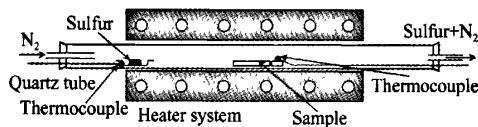


图 1 石英管电热硫化炉示意图

Fig. 1 Sulfurization system using a quartz glass tube furnace

### 3 结果与讨论

#### 3.1 化学配比与 XRD 结果

我们固定蒸发源 ZnS、Sn 的质量,改变 Cu 的质量,在钠钙玻璃衬底上制备了 4 个 Cu/Sn/ZnS 前驱体,分别编号为 1,2,3 和 4,前驱体的各层所用蒸发源质量、预计原子比及部分测试数据列于表 1。

表 1 前驱体各层所用蒸发源的质量、预期原子比和 CZTS 薄膜(112)峰的半高宽

Table 1 Evaporation mass of each precursors layer and predicted atomic ratio, CZTS films FWHM of (112)

编号	各层所用蒸发源的质量/mg			预期原子比		半高宽 (°)
	ZnS	Sn	Cu	$\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$	$\text{Zn}/\text{Sn}$	
1	170.39	150.47	60.19	0.26	1.38	0.45
2	170.27	150.56	100.45	0.52	1.38	0.39
3	170.38	150.29	150.23	0.78	1.38	0.29
4	170.34	150.14	200.43	1.05	1.38	0.31

图 2 所示为由不同前驱体制备的 CZTS 薄膜样品的 XRD 图,前驱体经硫化制备的 CZTS 薄膜样品相应编号为 1\*, 2\*, 3\* 和 4\*. 图中 2\*, 3\* 和 4\* 薄膜样品均在  $2\theta = 28.51^\circ, 33.11^\circ, 47.34^\circ$  和  $56.26^\circ$  处出现较强的衍射锐峰,分别对应类黝锡矿结构 CZTS 晶体(112),(200),(220)和(312)晶向的特征峰。1\* 样品的(112)衍射峰较弱,这是由于制备 1 号前驱体的蒸发源 Cu 的质量过小,预计比值  $\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$  为 0.26,偏离化学计量比较大,薄膜中 CZTS 相(112)峰的半高宽(FWHM)为  $0.45^\circ$ ,结晶质量不高,但未观察到二次相的衍射峰。4\* 样品的 XRD 图中  $32.21^\circ$  和  $46.41^\circ$  处分别代表 CZTS 薄膜中的  $\text{Cu}_2\text{S}$  和  $\text{Cu}_{1.97}\text{S}$  二次相衍射峰,可以看出该薄膜中的晶相主要有 CZTS 和  $\text{Cu}_{1.97}\text{S}$ ,但 CZTS 占主要比例。 $\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$  为 1.05 时,薄膜中 Cu 过量,为富铜型 CZTS 多晶薄膜。所有薄膜的 XRD 图谱中没有观察到三元化合物  $\text{Cu}_2\text{SnS}_3$  的相,原因是制备前驱体时 ZnS 过量,使  $\text{Zn}/\text{Sn}$  原子比大于 1, $\text{Cu}_2\text{SnS}_3$  相不易形成<sup>[9]</sup>。由 XRD 衍射峰的强度与半高宽值对前驱体中预计比值  $\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$  的依赖关系可知,CZTS 薄膜的结晶质量随着  $\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$  的增大而提高,当  $\text{Cu}/(\text{Zn} + \text{Sn})$  为 0.78 时,3 号前驱体经硫化得到具有类黝锡矿结构的单一相 CZTS 薄膜。

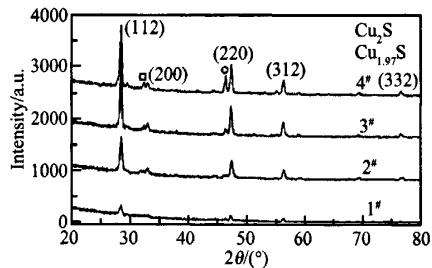


图 2 不同前驱体制备 CZTS 薄膜的 XRD 图

Fig. 2 XRD patterns of the CZTS thin films prepared with various type precursors

#### 3.2 光学性质

对 3\* 薄膜样品进行光吸收测量,得到光学吸收系数  $\alpha$  与入射光子能量  $hv$  之间的吸收特性曲线,如图 3 所示。可以看出,CZTS 薄膜对可见光的吸收系数  $\alpha$  高于  $10^4 \text{ cm}^{-1}$ ,并随着入射光子能量的增大,  $\alpha$  逐渐增大。CZTS 薄膜作为一种直接带隙半导体材料,其光学禁带宽度可由(1)式求得。

$$(hv\ln(1/T))^2 = A(hv - E_g) \quad (1)$$

样品的  $(hv\ln(1/T))^2$  与  $hv$  的函数关系曲线如图 4 所示,将其线性部分延长交于横轴( $(hv \times \ln(1/T))^2 = 0$ ),便可求得  $E_g$  的值,结果表明 CZTS

薄膜的光学带宽约为 1.51 eV.

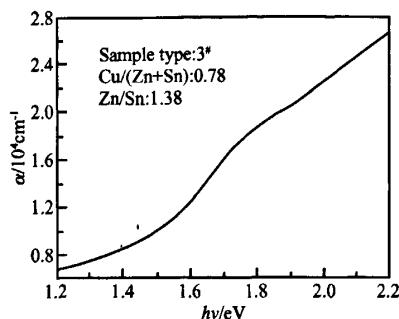


图 3 CZTS 薄膜的吸收系数  $\alpha$  与  $h\nu$  的关系曲线图

Fig. 3 Relation between absorption coefficient  $\alpha$  and  $h\nu$  of the CZTS thin film

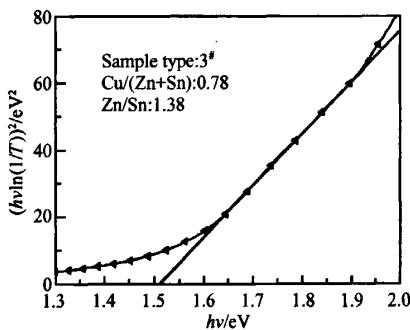


图 4 CZTS 薄膜的  $(h\nu \ln(1/T))^2$  与  $h\nu$  的关系曲线图

Fig. 4 Relation between  $(h\nu \ln(1/T))^2$  and  $h\nu$  of the CZTS thin film

### 3.3 电学性质

由 Hall 效应测试仪测量得到的数据列于表 2, 数据显示所有薄膜都为 p 型半导体, 随着预计比值 Cu/(Zn + Sn) 的改变, 薄膜的电阻率变化较大

表 2 CZTS 薄膜的 Hall 效应测试结果

Table 2 Results of the Hall effect measurements of the CZTS thin films

样品 No.	面电阻率 / ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	载流子迁移率 / ( $\text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ )	载流子浓度 / $\text{cm}^{-3}$	传导类型
1#	312.32	0.065	$5.85 \times 10^{16}$	p
2#	63.79	0.872	$5.31 \times 10^{17}$	p
3#	1.46	4.2	$2.37 \times 10^{18}$	p
4#	5.52	2.48	$7.75 \times 10^{18}$	p

(1.46~312.32  $\Omega \cdot \text{cm}$ )、载流子浓度在  $5.85 \times 10^{16}$  ~ $7.75 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  之间变化, 4# 样品的载流子浓度较高 ( $7.75 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ), 是因为薄膜中有 Cu<sub>2</sub>S, Cu<sub>1.97</sub>S 的二次相。3# 薄膜样品的电阻率、载流子迁移率和载流子浓度分别为  $1.46 \Omega \cdot \text{cm}$ ,  $4.2 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$  和  $2.37 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 。

## 4 结论

本文采用真空蒸镀前驱体后硫化的方法, 在钠钙玻璃衬底上成功制备了多晶 Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> 薄膜。研究了前驱体中各成分的预期原子比对硫化法制备的 CZTS 薄膜的结构和光电特性的影响。实验结果显示, CZTS 薄膜的晶体结构和光电特性强烈依赖于前驱体中各成分的化学配比, 通过对前驱体 Cu, Zn, Sn 原子比的优化, 制备出具有单一相类黝锡矿结构的 CZTS 薄膜, 该薄膜具有与太阳光谱非常匹配的直接宽带隙 (1.51 eV) 和对可见光的高吸收系数 ( $10^4 \text{ cm}^{-1}$ ), 薄膜的电阻率、载流子迁移率和载流子浓度分别为  $1.46 \Omega \cdot \text{cm}$ ,  $4.2 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ,  $2.37 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ , 适合作为薄膜太阳电池的吸收层。

## 参考文献

- [1] Ito K, Nakazawa T. Electrical and optical properties of stannite-type quaternary semiconductor thin film. *Jpn J Appl Phys*, 1988, 27, 2094
- [2] Tanaka T, Nagatomo T, Kawasaki D. Preparation of Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> thin films by hybrid sputtering. *J Phys Chem Solids*, 2005, 66, 1978
- [3] Katagiri H. Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> thin film solar cells. *Thin Solid Films*, 2005, 480/481, 426
- [4] Nitsche R, Sargent D F, Wild P. Crystal growth of quaternary Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> Chalcogenides by iodine vapor transport. *J Cryst Growth*, 1967, 1, 52
- [5] Schafer W, Nitsche R. Tetrahedral quaternary chalcogenides of the type Cu<sub>2</sub>-II-IV-S<sub>4</sub>(Se<sub>4</sub>). *Mater Res Bull*, 1974, 9, 645
- [6] Friedlmeier Th M, Wieser N, Walter T, et al. Proceedings of the 14th European Conference of Photovoltaic Science and Engineering and Exhibition, Bedford, 1997, 1242
- [7] Katagiri H, Jimbo K, Moriya K. Proceedings of the 3rd World Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion, Osaka, 2003, 2874
- [8] Katagiri H, Ishigaki N, Ishida T. Characterization of Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> thin films prepared by vapor phase sulfurization. *Jpn J Appl Phys*, 2001, 40, 500
- [9] Nakayama N, Ito K. Sprayed films of stannite Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>. *Appl Surf Sci*, 1996, 92, 171

## Electrical and Optical Properties of Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>Thin Films Prepared for Solar Cell Absorber\*

Shao Lexi<sup>1,†</sup>, Fu Yujun<sup>2</sup>, Zhang Jun<sup>1,2</sup>, and He Deyan<sup>2</sup>

(1 School of Physics Science and Technology, Zhanjiang Normal University, Zhanjiang 524048, China)

(2 School of Physics Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

**Abstract:** Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) thin films were successfully prepared by sulfurization of vacuum evaporating Cu/Sn/ZnS precursors on soda-lime glass substrate. The crystallographic structures of the samples were determined by X-ray diffractometer. The electrical and optical properties were analyzed by Hall measurement and UV-VIS spectrophotometer. The influence of the predicted atomic ratio on electrical and optical properties of CZTS thin films was discussed. The single phase stannite-type structure CZTS thin films possesses the absorption coefficient more than 10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup>, band gap energy of about 1.51eV, low electrical resistivity and high mobility, so this thin film is suitable to the use as the absorber in thin film solar cells.

**Key words:** Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>; vacuum evaporation; sulfurization; solar cell

**PACC:** 6855; 8115; 7865P

**Article ID:** 0253-4177(2007)S0-0337-04

\* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 10574106)

† Corresponding author. Email: shaolx@mail@163.com

Received 5 January 2007, revised manuscript received 6 March 2007

©2007 Chinese Institute of Electronics